Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0499U002434

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-10-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бобро Валерій Васильович
2. Bobro Valerij Vasyl'ovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 01.04.01

Назва наукової спеціальності: Фізика приладів, елементів і систем

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 23-09-1999

Спеціальність за освітою: 631

Місце роботи здобувача: ВАТ Феодосійський приладобудівний завод

Код за ЄДРПОУ: 14308055

Місцезнаходження: Україна, Феодосія, вул. Симферопольське шосе, 48

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 55.051.02

Повне найменування юридичної особи: Сумський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 05408289

Місцезнаходження: вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут прикладної фізики НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05399225

Місцезнаходження: 40030, м. Суми, вул Петропавлівська 58

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 29.31.21

Тема дисертації:

1. Основні шляхи досягнення граничних можливостей методу еліпсометрії

2. Main ways of achieving maximum capabilities of the ellipsometry method

Реферат/анотація:

1. Еліпсометри. Розроблені способи подолання основних труднощів на шляху практичної реалізації однозонної методики еліпсометричних вимірювань та запропоновано нову метрологію в еліпсометрії.Намічена схема проведення метрологічних робіт. Розроблено методи розвязання зворотнє задачі еліпсометрії. Показано, що статистичний підхід до розвязання некоректної задачі еліпсометрії для надтонких поверхневих плівок, який пропонуї нові критеріє вибору оптимальноє точки, приводить до сталих результатів і дозволяї успішно досліджувати поверхневі плівки товщиною від 2 до 10 нм.

2. Ellipsometry. The investigations follow three principal directions. It is shown how to overcome problems encountered in the implementation of the one-zone procedure in ellipsometry measurements. New well-grounded ellipsometry metrology is presented based on the onezone procedure. A scheme is described for the metrology operation. The techniques are proposed for the solution of the inverse problem in ellipsometry. The statistical approach to the solution of the ellipsometry incorrect inverse problem for ultrathin films which includes new criteria for the choice of the optium point is shown to provide reliable data permitting surface film ranging from 2

to 10 nm to be examined.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Семененко А.І.
2. Семененко А.І.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.05

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шайкевич І.А.
2. Шайкевич І.А.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Погребняк О.А.

2. Погребняк О.А.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Проценко І.Ю.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Проценко І.Ю.

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.